


TOF-SIMSによるAuめっき表面変色部分分析

nmオーダーの極表面における表面分析アプリケーションのご紹介

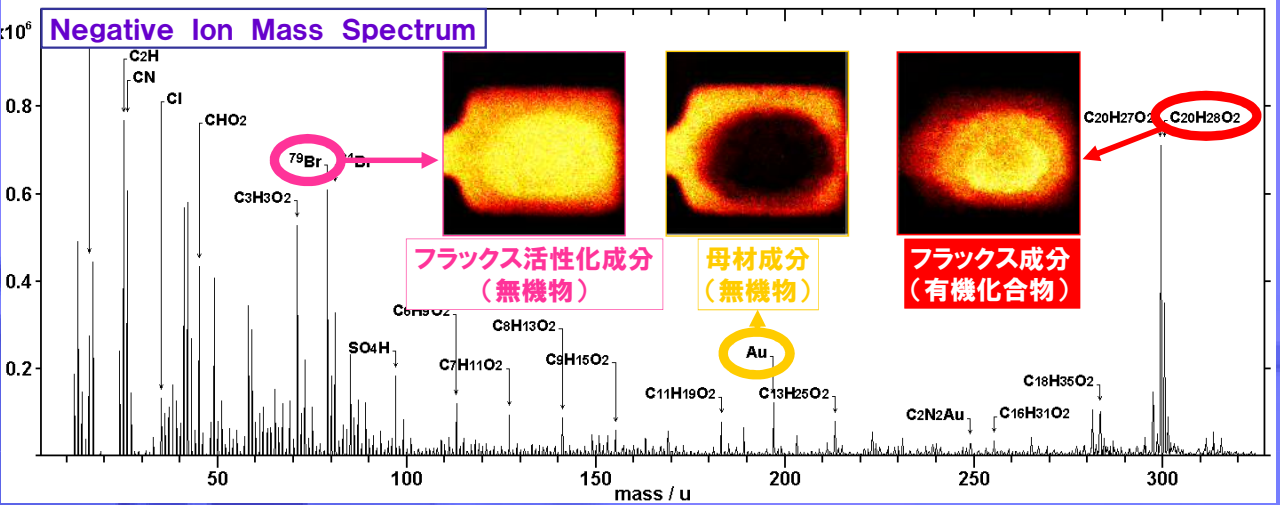
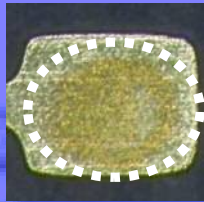
	AES	XPS	TOF-SIMS
絶縁物	×	○	○
定量性	○	○	×(ただし高感度)
取得情報	×	△	○ (化合物構造)



(TOF-SIMS: iontof5)

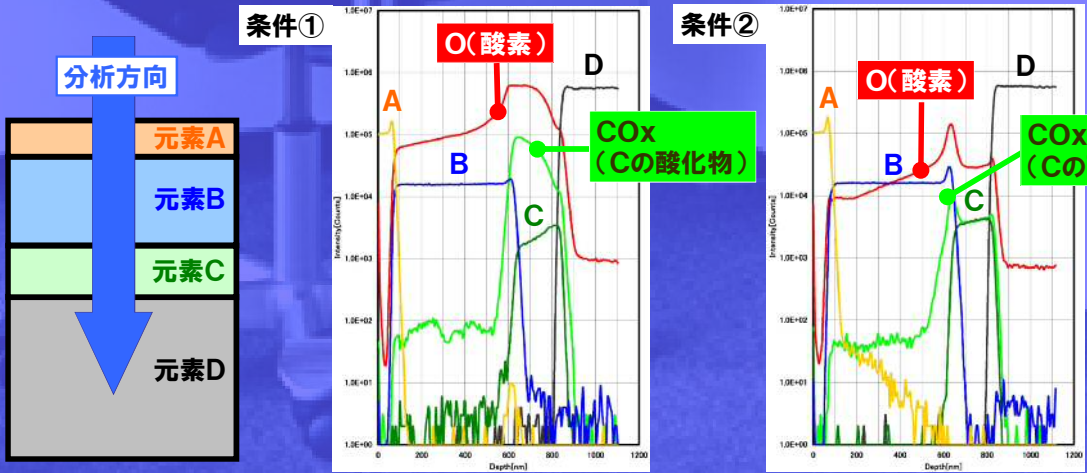
例えば
こんなことができます!

表面定性分析&表面イメージング(Auめっき表面変色部分分析)



有機物・無機物問わず同時にかつ詳細に高感度で分析可能

深さ方向分析(金属多層膜中のO及び酸化物の存在確認)



単体元素だけでなく、化合物においても高感度で深さ方向分析を実施する事が可能